





.....	6
.....	6
.....	6
.....	8
.....	10
.....	10
.....	13
.....	15
.....	16
.....	16

1

2

1	DL/T845.1-2004 /
2	DL/T474.1-2006 /

1

2mA(5: ǔ 2i Đ

2

10mA

3

0.1MΩ 1999GΩ

4

0.1kV 0.25kV 0.5kV 1kV

2.5kV 5kV

0V

ψ

5

ψ

ψ ψ

6

ψ

Π Đn

1	0.1kV	0.25kV	0.5kV	1kV	2.5kV	5kV
2	$\pm (5\% \quad 10V)$					
3	10mA					
4						
	0.1	19.99M Ω		20M Ω		
100V						

20MΩ	± (5% 3d)	0.01MΩ
200MΩ	± (5% 3d)	0.1MΩ
2000MΩ	± (5% 3d)	1MΩ
20GΩ	± (5% 3d)	0.01GΩ
200GΩ	± (10% 3d)	0.1GΩ
2000GΩ	± (20% 10d)	1GΩ

MΩ

0.5kV GΩ

2.5kV

20%

l n Ω

Ω



“ L ”	“ G ”	“ E ”
		“ ON ”

1 “ L ”

2 “ G ”

“ G

6	“ MΩ ”		
	MΩ	“ GΩ ”	
GΩ			
7		15S	60S 1MIN
		3S	3S
	/		
8			“ ”
9	“ ON ”		
10		12V	
11			
12			
	“ ”	“ 0 ”	
13			MΩ /G
Ω			
14		0V	
15			
16		“ L ”	

17

“ L ” “ E ”

8

1

“ ” “

”

2

“ L ”

“ E ”

“ G ”

3

“ ”

4

“ ”

0 “ ” 1

5

“ ”

“ L ”

“ L ” “ E ”

6

“ ”

7

“ ”

MΩ

2000GΩ

8

“ MΩ / GΩ ”

“

”

15

60

60

=R60 {

1

1		12V	
2			
3	8		
4			BU406 C2482
5			CA3140
6	-1		AD
7			

1		1	
2		2	
3		2	
4		1	
5		1	
6	(1GΩ)	1	
7		1	
8		1	
9		1	

Figure 1: Circuit diagram of the test setup.



